

Methodenverzeichnis *(mit Seitenzahlen)*

VLM 2	Lichtmikroskopie	EBSD 56	KIKUCHI-Beugung
SNOM 4	Optische Rasternahfeldmikroskopie	NBD 58	Nano-Elektronenbeugung
REM 6	Rasterelektronenmikroskopie	EDX 60	Energiedispersive Röntgenspektroskopie
TEM 8	Transmissionselektronenmikroskopie	WDX 62	Wellenlängendispersive Röntgenspektroskopie
EFTEM 10	Energiegefilterte Transmissions-elektronenmikroskopie	ED-/WD-RFA 64	Röntgenfluoreszenzanalyse
HIM 12	Helium-Ionen-Mikroskopie	TXRF 66	Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse
FIB 14	Ionenfeinstrahltechnik	XPS 68	Röntgenphotoelektronenspektroskopie
AFM 16	Rasterkraftmikroskopie	EXAFS, XANES 70	Röntgenabsorptions-spektroskopie
KERR 18	Magnetooptische KERR-Mikroskopie	AES 72	AUGER-Elektronenspektroskopie
3D-AP 20	Atomsonde	EELS 74	Elektronenenergieverlustspektroskopie
Thermographie 22	Thermographie	SIMS 76	Sekundärionen-Massenspektrometrie
TherMoiré 24	TherMoiré	LEIS, MEIS 78	Ionenstrahlspektroskopie
RGS 26	Röntgengrobstrukturinspektion	RBS 80	RUTHERFORD-Rückstreu-Spektrometrie
XCT 28	Röntgen-Computertomographie	RS 82	RAMAN-Spektroskopie
XCL 30	Röntgen-Computerlaminographie	GDOES 84	Optische Glimmentladungsspektroskopie
XRM 32	Röntgenmikroskopie	FTIR 86	Fouriertransformierte IR-Spektroskopie
EBIC, EBAC 34	Electron Beam Induced Current Electron Beam Absorbed Current	VASE 88	Winkelvariierende Spektroskopische Ellipsometrie
OBIRCH 36	Optical Beam Induced Resistivity Change	DTA 90	Differenz-Thermoanalyse
EBI 38	Electron Beam Inspection	DSC 92	Dynamische Differenzkalorimetrie
VC 40	Potenzialkontrast	US 94	Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren
LAUE 42	LAUE-Verfahren	SAM 96	Ultraschallmikroskopie
XRD 44	Röntgenvielkristalldiffraktometrie	EC 98	Wirbelstromtechnik
KT 46	KOSSEL-Technik	VSM 100	Vibrationsmagnetometer
RDS 48	Röntgen-Drehschwenk-Technik		
XRR 50	Röntgenreflektometrie		
XRT 52	Röntgentopographie		
SAXS 54	Röntgenkleinwinkelstreuung		

Physikalische Werkstoffdiagnostik

Ein Kompendium wichtiger Analytikmethoden für
Ingenieure und Physiker

Bauch, J.; Rosenkranz, R.

2017, IX, 103 S., Hardcover

ISBN: 978-3-662-53951-4